

{joomplu:1735}С 7 по 8 июня 2021 года в г. Лыткарино в ДК «МИР» прошла 25-я Всероссийская научно-техническая конференция «Радиационная стойкость электронных систем» (СТОЙКОСТЬ-2022). В конференции приняло участие 226 участников из 30 организаций, было представлено всего 108 стендовых и 27 устных докладов, из которых сотрудники Консорциума «ЭНПО СПЭЛС» - НИЯУ МИФИ» представили 40 стендовых и 8 устных докладов, в том числе на актуальные темы в развитие принятого в марте 2021 года КГВС «Климат-8»:

Армен Вагоевич Согоян

А.В. Согоян

1,2

1

НИЯУ МИФИ

Методы

Александр Иннокентьевич Чумаков

А.И. Чумаков

1,2

1

НИЯУ МИФИ,

Оценка уровней сбоев в ИС при нейтронном воздействии различной интенсивности

Андрей Борисович Каракозов

А.Б. Каракозов, В.А. Марфин, К.А. Москаленко

НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»

Исследование вероятности сбоя цифровых сложно-функциональных микросхем при импульсном облучении

Николай Александрович Усачев

Н.А. Усачев, Д.И. Сотсков, Н.М. Жидков, И.А. Жидков

НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»

Цифровые модели ЭКБ для радиоэлектронной аппаратуры доверенного назначения

Никита Михайлович Жидков

Н.М. Жидков, Д.И. Сотсков, К.М. Амбуркин, И.А. Жидков

НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»

Показатели стойкости	GaAs
----------------------	------

Александр Александрович Печенкин

А.Н. Егоров, О.Б. Маврицкий,	<u>А.А. Печенкин</u>
------------------------------	----------------------

НИЯУ МИФИ,	АО «ЭНПО СПЭЛС»
------------	-----------------

Практический опыт использования двухфотонного поглощения лазерного излучения для исследования

Андрей Георгиевич Петров

<u>А.Г. Петров</u>	, И.И. Швецов-Шиловский, С.Б.
--------------------	-------------------------------

НИЯУ МИФИ,	АО «ЭНПО СПЭЛС»
------------	-----------------

Сравнительный анализ стойкости резистивной и других видов ИСРГ не зависящей от температуры

Андрей Александрович Аникин

<u>А.А. Аникин</u>	, К.А. Епифанцев, П.К. Скоробогатов
--------------------	-------------------------------------

НИЯУ МИФИ,

АО «ЭНПО СПЭЛС»

Особенности проведение испытаний на импульсную электрическую прочность в активном элек